

IPS 2011 am 06.10.2011 – Agenda des IAVT

- Beginn:** 09:00 Uhr - Zentrale Begrüßung durch den Dekan
09:15 Uhr - Keynote-Vortrag (bis ca. 09:45 Uhr)

IAVT-Kolloquium zum Thema „Fortschritte in der zerstörungsfreien Prüfung für die AVT“

- 10:00 Uhr Zerstörungsfreie Prüfverfahren für die 3D-Integration in der Aufbau- und Verbindungstechnik
Prof. Klaus-Jürgen Wolter, TU Dresden, IAVT
- 10:30 Uhr Kaffeepause
- 11:15 Uhr Transmission electron microscopy for the characterization of nanoelectronic devices
Dr. René Hübner, Fraunhofer IZFP-D
- 11:45 Uhr Konfokale Hochgeschwindigkeitsmesstechnik für die Bumpingkontrolle
Jürgen Valentin, NanoFocus AG, Oberhausen
- 12:15 Uhr 3D-Terahertz-Bildgebung verborgener Defekte in dielektrischen Materialien
Dr. Stefan Becker, Becker Photonik GmbH, Porta Westfalica
- 12:45 Uhr Mittagspause
- 13:45 Uhr Blick in das Package - Möglichkeiten und Grenzen der zerstörungsfreien Charakterisierung mittels Röntgenmikroskopie
Dr. Martin Oppermann, TU Dresden, IAVT
- 14:15 Uhr Hochfrequenz-Wirbelstromtechnik für die Inspektion großflächiger Elektronik
Dr. Henning Heuer, Fraunhofer-IZFP-D
- 14:45 Uhr Bestimmung elastischer Eigenschaften dünner Schichten mittels AFAM
Dr. Malgorzata Kopycinska-Müller, TU Dresden, IAVT; IZFP-D
- 15:15 Uhr Kaffeepause
- 16:00 Uhr Charakterisierung der Mikrostruktur von Loten mittels EBSD
Maik Müller, Iuliana Panchenko, TU Dresden, IAVT
- 16:30 Uhr Messung der Verwindung und Verwölbung von Bauelementen mittels Schatten-Moiré-Technik
Dr. Heinz Wohlrabe, TU Dresden, IAVT

Ende ca. 17:00 Uhr